# Зонный спектр и двойной фазовый переход проводимости металл–диэлектрик–металл в упругонапряженном бесщелевом Cd<sub>x</sub> Hg<sub>1-x</sub>Te

© Е.Ф. Венгер, С.Г. Гасан-заде<sup>¶</sup>, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины, 01650 Киев, Украина

(Получена 29 августа 2006 г. Принята к печати 30 августа 2006 г.)

При одноосной упругой деформации у бесщелевого полупроводника  $Cd_xHg_{1-x}$  Те между дном зоны проводимости и вершиной валентной зоны образуется энергетическая щель. Оказывается, что зонная структура нового состояния зависит от исходного расположения валентных подзон, т.е. от состава *x*. Для x < 0.135-0.140 материал становится полупроводником с непрямой запрещенной зоной. Если же 0.140 < x < 0.160, то при больших деформациях зона легких дырок  $\Gamma_6$  в точке  $\mathbf{k} = 0$  оказывается выше зоны  $\Gamma_8$ . В результате полупроводник становится прямозонным, и происходит двойной фазовый переход проводимости металл-диэлектрик-металл. При этом, по мере роста деформации, тип проводимости бесщелевого полупроводника при низких температурах меняется в следующей последовательности: электронная металлическая-электронная активационная-прыжковая-дырочная металлическая проводимость.

PACS: 71.20.Nr, 71.28.+d, 71.30.+h, 62.20.Fe

### 1. Введение

Твердый полупроводниковый раствор Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te при составах  $x \le 0.160 \ (T = 4.2 \, \text{K})$  находится в бесщелевом состоянии, когда дно зоны проводимости в точке  ${f k}=0$ соприкасается с вершиной валентной зоны. При этом во всем диапазоне составов  $0 < x < x_0$  (величина  $x_0$ ) зависит от температуры) энергетический спектр такого бесщелевого полупроводника (БП) описывается инверсной зонной моделью Гровса-Пола. В соответствии с этой моделью экстремум зоны  $\Gamma_6$  при составах  $x < x_0$  уже располагается ниже экстремумов подзон  $\Gamma_8$ , а кривизна зоны Г<sub>6</sub> и крутой ветви зоны Г<sub>8</sub> меняется на противоположную (см. рис. 1, a). Энергетический зазор между  $\Gamma_6$ и Г<sub>8</sub> становится отрицательным и носит название "отрицательной запрещенной зоны"  $|E_g| = E_{\Gamma 6} - E_{\Gamma 8}$ . Для дальнейшего важно подчеркнуть, что при постоянной температуре зазор  $|E_g|$  определяется исключительно значением состава x. Он максимален при x = 0, т.е. для HgTe, и равен 0 при  $x = x_0$ . При  $x > x_0$  Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te становится полупроводником с обычным порядком зон и нормальной (положительной) запрещенной зоной E<sub>g</sub>.

БП  $Cd_xHg_{1-x}$  Те относится к бесщелевым полупроводникам второго рода. В таких материалах отсутствие энергетической щели связано не со случайным вырождением зон (как, например, у  $Pb_xSn_{1-x}$ Te), а является следствием симметрии кристаллической решетки. Поэтому лишь такое внешнее воздействие, которое понижает симметрию кристалла, приводит к снятию вырождения зон  $\Gamma_8$  и образованию между ними энергетической щели. Понятно, что при этом должны происходить качественные изменения электронных свойств БП. Поэтому исследование БП при упругой одноосной деформации [1–5] в недавнее время вызвали значительный интерес. Было установлено, что наложение упругого направленного напряжения **P** на БП  $Cd_xHg_{1-x}$  Те приводит к образованию у него в точке **k** = 0 энергетической щели, которая линейно растет с увеличением *P*. Кроме того, в плоскости, перпендикулярной к оси сжатия, у валентной зоны тяжелых дырок  $\Gamma_8$  возникает петля экстремумов. Вершина петли лежит выше середины энергетической щели  $\varepsilon_0(P)$ , индуцированной сжатием в точке **k** = 0 (рис. 1, *b*). При этом закон дисперсии вблизи экстремума валентной зоны в продольном направлении описывается малой эффективной массой. Резонансный акцепторный уровень (или "акцепторная зона"), которые в отстутвии деформации находятся в зоне проводимости, при наложении *P* также расщепляются. В результате нижний из расщепленных уровней, следуя за вершиной



**Рис. 1.** Трансформация зонного спектра бесщелевого полупроводника под влиянием одноосного сжатия при T = 4.2 К. Сплошные линии — **P** || **k**, штриховые — **P**  $\perp$  **k**.

<sup>¶</sup> E-mail: gassan@isp.kiev.ua

валентной зоны, выходит в образованную деформацией энергетическую щель [4].

На основании результатов, полученных из измерений электрических, гальваномагнитных и фотоэлектрических свойств БП, можно заключить, что однооснонапряженный БП  $Cd_xHg_{1-x}$ Те представляет собой полупроводник с совершенно необычным спектром свободных и связанных состояний. Кроме того, бесщелевой  $Cd_xHg_{1-x}$ Те может представлять также и прикладной интерес как перспективный материал для разработки перестраиваемых по энергии приемников и источников излучения дальнего инфракрасного (ИК) диапазона [6].

Недавно в упругонапряженном  $Cd_xHg_{1-x}Te$ (x = 0.10 - 0.14)в условиях ударной ионизации электрическим полем было обнаружено достаточно интенсивное стимулированное ИК-излучение (диапазон около 100 мкм) [7]. Этот результат вызывает новый интерес к упругонапряженному состоянию БП. В частности, следует возвратиться к особенностям зонной структуры упругонапряженного БП, которые остались не до конца изученными. Речь идет о влиянии удаленной зоны  $\Gamma_6$  на вид экстремумов зоны тяжелых дырок  $\Gamma_8$ , а также на состояния акцепторных уровней. Понимание этих особенностей может облегчить индентификацию оптических переходов, ответственных за упомянутое выше стимулированное излучение одноосно-напряженного  $Cd_xHg_{1-x}$ Te. Наконец, дальнейшие исследования БП необходимы и для устранения противоречий между результатами, полученными ранее в разных работах для материала с различным составом х. В частности, нуждается в объяснении появление в валентной зоне упругодеформированного  $Cd_xHg_{1-x}Te$  (даже при очень низких температурах  $T = 1.7 - 4.2 \,\mathrm{K}$ ) свободных дырок с аномально высокими подвижностями [1].

В настоящей работе приведены результаты теоретических расчетов энергетического спектра БП  $Cd_xHg_{1-x}$ Те вблизи экстремумов зон  $\Gamma_8$  и  $\Gamma_6$  в зависимости от состава *x* и сделаны численные оценки. Для сопоставления с расчетными оценками здесь же приведены результаты измерений деформационных, температурных и магнитополевых зависимостей коэффициента Холла  $R_H$ и удельного электрического сопротивления  $\rho$  образцов БП  $Cd_xHg_{1-x}$ Те для нескольких значений *x*.

#### 2. Теоретические соотношения

Для упругонапряженного БП вид экстремумов валентной зоны, полученный в приближении модели Латтинджера, т.е. без учета влияния зоны  $\Gamma_6$ , показан на рис. 1, *b* [1,2]. В точке **k** = 0 возникает индуцированная сжатием петля экстремумов, вершина которой лежит выше середины энергетической щели  $\varepsilon_0(P)$ . При этом закон дисперсии вблизи экстремума валентной зоны и энергетическое положение мелкого акцептора описывались малой эффективной массой. Следует отметить, что

Физика и техника полупроводников, 2007, том 41, вып. 3

подробного теоретического рассмотрения в [1] проведено не было — авторы ограничились простой оценкой. В [2] было показано, что решение задачи об энергии ионизации и волновой функции акцептора с учетом наличия петли экстремумов в действительности имеет более сложный вид. Интерпретация экспериментальных результатов, полученных в [1], была поставлена под сомнение в [2]. В частности, появление легких дырок в валентной зоне [1] связывалось в [2] с возможной неоднородностью по *x* исследованных в [1] образцов. Позднее, в обзоре [3] была показана схема зонной структуры упругодеформированного БП  $Cd_xHg_{1-x}$ Те с учетом вклада зоны  $\Gamma_6$ , однако теоретические расчеты при этом приведены не были.

Важно отметить, что для решения задачи о зонном спектре  $Cd_xHg_{1-x}$  Те в первую очередь — для составов x, близких к критическому значению  $x_0 = 0.160$  (T = 4.2 K), двухзонное приближение Латтинджера, принятое в [1,2], становится уже неприемлемым. Здесь требуется применение трехзонного приближения в рамках модели Кейна, поскольку влиянием близко расположенной зоны  $\Gamma_6$  пренебречь уже нельзя. Перестройка деформацией энергетического спектра БП  $\xi(k)$  для случая большого спин-орбитального расщепления и бесконечной массы тяжелых дырок определяется [5] выражением

$$\frac{k^2}{2m} = \frac{[\xi(k) - \varepsilon_g(P)][\xi(k)^2 - \varepsilon_0^2/4]}{|\varepsilon_g| \left[\xi(k) + \frac{\varepsilon_0}{2} P_2(\cos\theta)\right]}.$$
 (1)

Здесь  $\varepsilon_g$  — "отрицательная запрещенная зона" в недеформированном материале (рис. 1),  $\varepsilon_g(P) = \varepsilon_g$ +  $(c - a)\varepsilon_{def}$  — изменение этого параметра в однооснодеформированном кристалле (в дальнейшем мы рассматриваем деформацию вдоль кубической оси z),  $\varepsilon_0 = 2b(\varepsilon_{zz} - \varepsilon_{xx})$  — энергия расщепления вырожденного терма  $\Gamma_8$ , где  $\varepsilon_{def} = \Sigma \varepsilon_{ii}$  — тензор деформации, a, bи c — деформационные потенциалы, m — эффективные массы легкой подзоны  $\Gamma_8$  и терма  $\Gamma_6$  в приближении симметричных зон (когда эффективная масса тяжелых дырок считается бесконечной),  $P_2 = (3x^2 - 1)/2$ ,  $\theta$  — угол между волновым вектором k и направлением сжатия.

Индуцированная давлением энергетическая щель определяется областью энергий, для которых правая часть (1) отрицательна, т.е. возможны лишь решения с мнимой энергией  $\xi$ . Из уравнения (1) следует, что электронный экстремум находится в точке  $\mathbf{k} = 0$  и имеет энергию  $\varepsilon_0/2$ . При выполнении соотношения  $\varepsilon_g(P) < \varepsilon_0/4$  дырочные экстремумы расположены при  $\mathbf{k} \to \infty$ ,  $\theta = \pm \pi/2$  и имеют энергию  $\varepsilon_0/4$ . При учете конечности эффективной массы тяжелых дырок экстремумы смещаются в область конечных волновых векторов, а их энергия несколько понижается. Закон дисперсии вблизи петлеобразного дырочного экстремума определяется выражением  $k_z^2/2m_z$  с малой продольной эффективной массой [1,2].

Однако по мере смещения вершины зоны Г<sub>6</sub> вверх с увеличением деформации Р величина энергетического зазора в точке  $\mathbf{k} = 0$  существенно уменьшается (рис. 1, *c*) по сравнению со значением  $\varepsilon_0$ , полученным в рамках двухзонного приближения Латтинджера. В точке  $\varepsilon_g(P) = \varepsilon_0/4$  валентная зона в приближении бесконечно большой массы тяжелых дырок становится плоской в поперечном к сжатию направлении. Когда же выполняется обратное соотношение:  $\varepsilon_g(P) > \varepsilon_0/4$ , полупроводник вновь становится прямозонным (рис. 1, d, e). Спектры электронов и дырок для продольного направления вблизи экстремума теперь описываются соотношениями с малыми кейновскими эффективными массами. Последние перенормированы на зависящую от давления фактическую ширину запрещенной зоны  $\varepsilon_0/2 - \varepsilon_g(P)$ (расстояние между верхним расщепленным термом Г<sub>8</sub> и термом  $\Gamma_6$ ):

$$\xi_{c\parallel} = \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{|\varepsilon_g|}{\frac{\varepsilon_0}{2} - \varepsilon_g(P)} \frac{k_{\parallel}^2}{2m},$$
  
$$\xi_{v\parallel} = \varepsilon_g(P) - \frac{|\varepsilon_g|}{\frac{\varepsilon_0}{2} - \varepsilon_g(P)} \frac{k_{\parallel}^2}{2m}.$$
 (2)

Отметим, что для больших значений k эти спектры приобретают линейный кейновский вид.

Для поперечного направления аналитическое общее решение уравнения (1) весьма громоздко. Однако вблизи краев зон справедливы соотношения

$$\xi_{c\perp} = \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{|\varepsilon_g|}{\frac{\varepsilon_0}{2} - \varepsilon_g(P)} \frac{k_{\perp}^2}{6m},$$
  
$$\xi_{v\perp} = \varepsilon_g(P) - \frac{|\varepsilon_g|}{\frac{\varepsilon_0}{2} - \varepsilon_g(P)} \frac{\varepsilon_g(P) - \frac{\varepsilon_0}{4}}{\varepsilon_g(P) + \frac{\varepsilon_0}{2}} \frac{k_{\perp}^2}{2m}.$$
 (3)

Для больших значений **k** эти спектры приобретают тот же линейный кейновский вид, что и для продольного направления. Как видно из (3), эффективные массы носителей для поперечного направления больше, чем для продольного. Так, эффективная поперечная масса электронов превышает продольную в 3 раза. Для дырок соотношение поперечной и продольной масс зависит от величины деформации. Как уже говорилось ранее, в точке  $\varepsilon_g(P) = \varepsilon_0/4$  поперечная масса в принятом приближении бесконечна, а в точке  $\varepsilon_g(P) = \varepsilon_0/2$ , как видно из (3), соотношение поперечной и продольной масс стремится к 4. Для промежуточного значения  $\varepsilon_g(P) = 3\varepsilon_0/8$  поперечная масса превышает продольную в 7 раз. Точный учет конечности массы тяжелых дырок несколько уменьшает эти соотношения.

Согласно [3], значения деформационных потенциалов a, b, c для  $Cd_xHg_{1-x}$ Те при T = 4.2 К таковы, что  $\delta \varepsilon_g(P)/\delta P = 6$  мэВ/кбар,  $\delta \varepsilon_0(P)/\delta P = 2$  мэВ для  $P ||\langle 001 \rangle$  и лишь немногим отличаются для других кристаллографических направлений [2]. Отсюда следует, что для области реально достижимых упругих деформаций предельный случай  $\varepsilon_g(P) > \varepsilon_0/4$  (когда материал становится прямозонным) может быть реализован только при относительно малых значениях  $|\varepsilon_g| < 15-20$  мэВ. Таким образом, прямозонное состояние может быть достигнуто лишь для составов *x*, достаточно близких к критическому значению  $x_0$ . Для меньших же значений *x* зона  $\Gamma_6$  в точке  $\mathbf{k} = 0$  остается по энергии ниже зоны тяжелых дырок  $\Gamma_8$  во всем диапазоне реально достижимых упругих деформаций кристаллов  $Cd_xHg_{1-x}$ Те.

## Сопоставление экспериментальных результатов с теорией

Для экспериментальной проверки адекватности модели и правильности приведенных выше оценок были проведены измерения деформационных зависимостей удельного электрического сопротивления  $\rho$  и коэффициента Холла  $R_{\rm H}$  для образцов с несколькими значениями x. Результаты этих измерений могут также ответить на следующий вопрос: в каком именно экстремуме зоны тяжелых дырок  $\Gamma_8$  — боковом ( $\mathbf{k} \neq 0$ ) или расположенном в центре зоны Бриллюэна ( $\mathbf{k} = 0$ ) — появляются свободные дырки с аномально высокими подвижностями.

Исследованные образцы ориентировались рентгенографически, а состав x и пространственная однородность образцов по x определялись с помощью рентгеновского микроанализатора с точностью до 0.003. Параметры образцов приведены в таблице. Для всех исследуемых образцов концентрация акцепторов превышала концентрацию доноров ( $N_A > N_D$ ). Однако в исходном состоянии образцы сохраняли электронный тип проводимости во всем температурном диапазоне из-за большого отношения подвижностей электронов и тяжелых дырок  $\mu_e/\mu_h \approx 100$ .

Результаты измерений  $\rho(P)$  и  $R_{\rm H}(P)$  приведены на рис. 2. Как видно из рисунка, для образцов 1 и 2 по мере увеличения упругого напряжения наблюдается характерный максимум  $\rho$  и смена знака коэффициента Холла  $R_{\rm H}$  с дальнейшим выходом  $\rho$  и  $R_{\rm H}$  на полку при максимальных P (рис. 2, a, b). Отметим, что для образца 2 (с несколько большим значением  $|\varepsilon_g|$ ) эти особенности сдвинуты в область более высоких деформаций. Совокупность представленных на рис. 2, a, bданных для образцов 1 и 2 может быть объяснена переходом БП при значениях деформации P > 2-3 кбар

Параметры исследованных образцов  $Cd_xHg_{1-x}$ Te. T = 4.2 K

| № образца | Состав, х | $ \varepsilon_g $ , мэВ | <i>n</i> , см <sup>-3</sup> | $\mu_n,  \mathrm{cm}^2/\mathrm{B}{\cdot}\mathrm{c}$ |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1         | 0.157     | $\sim 5$                | $3.83\cdot 10^{14}$         | $6.81\cdot 10^5$                                    |
| 2         | 0.149     | $\sim 21$               | $5.27\cdot 10^{14}$         | $2.69\cdot 10^5$                                    |
| 3         | 0.098     | $\sim 116$              | $9.23\cdot 10^{14}$         | $1.24\cdot 10^5$                                    |
| 4         | 0.039     | $\sim 227$              | $1.14\cdot10^{15}$          | $1.72 \cdot 10^5$                                   |

Физика и техника полупроводников, 2007, том 41, вып. 3



**Рис. 2.** Зависимости удельного сопротивления  $\rho$  и коэффициента Холла  $R_{\rm H}$  от величины деформации для образцов с разными значениями состава x: a — образец 1, b — 2, c — 3, d — 4. T = 4.2 K.

в прямозонное состояние с энергетической щелью. При этом начальный рост  $\rho(P)$  и  $R_{\rm H}(P)$  очевидно связан с "вымораживанием" электронов из зоны проводимости на акцептор. Напомним, что нижний уровень акцептора по мере роста Р следует за вершиной валентной зоны и смещается в образованную деформацией энергетическую щель. Максимум и дальнейший спад  $\rho(P)$  наряду со сменой знака R<sub>H</sub> связаны с вкладом в проводимость конкурирующего механизма — ионизацией дырок в валентную зону. Последнее обусловлено уменьшением глубины залегания акцепторов по отношению к вершине валентной зоны. В области максимально достижимых деформаций (P<sub>max</sub>) подвижность свободных дырок, оцененная из произведения  $R_{\rm H}$  на  $(1/\rho)$ , достигает значений  $5 \cdot 10^5 \, \text{см}^2/\text{B} \cdot \text{с}$ , что близко по величине к подвижности электронов. Такое значение подвижности дырок может быть связано только с наличием у валентной зоны экстремума  $\Gamma_6$  с малой эффективной массой [2,3]. При этом для удельного сопротивления выполняется соотношение  $\rho_{\perp}/\rho_{\parallel} \approx 1.5 - 2.5$ . Последнее отражает степень анизотропии эффективной массы дырок вблизи экстремума и неплохо согласуется с приведенными выше теоретическими оценками.

Для образцов же 3 и 4 с меньшими значениями x (т.е. с большими  $|\varepsilon_g|$ ) наблюдаются монотонные зависимости  $\rho(P)$ , а смена знака  $R_{\rm H}$  отсутствует (рис. 2, *c*, *d*). Во всем диапазоне деформаций сохраняется электронный тип проводимости, что позволяет говорить о незначительном влиянии боковых экстремумов валентной зоны на глубину залегания акцептора. Важным дополнительным фактом является характер магнитополевых зависимостей коэффициента Холла для исследованных образцов. Для образцов 1 и 2 при P = 0, с одной стороны, и  $P_{\rm max}$  — с другой, в диапазоне магнитных полей H = 0-5 кЭ коэффициент  $R_{\rm H}$  практически не зависит от H. Это свидетельствует о том, что проводимость образца в обоих случаях определяется только одним типом носителей тока: электронов (P = 0) или свободных дырок ( $P_{max}$ ) соответственно. В области же промежуточных деформаций (P = 1-2.5 кбар)  $R_{\rm H}$  демонстрирует сильную зависимость от H, в том числе со сменой знака. Последнее указывает на присутствие в образце по крайней мере двух типов носителей. У образцов же 3 и 4 во всем диапазоне H и P коэффициент Холла сохраняет знак, соответствующий электронному типу проводимости.

Рассмотрим теперь температурные характеристики  $\rho$ и  $R_{\rm H}$  для разных значений упругого напряжения. Именно из них можно получить полезную информацию об энергиях активации для проводимостей разного типа. На рис. 3–5 показаны зависимости от температуры  $\rho(P)$ и  $R_{\rm H}(P)$  для образцов первой и второй группы соответственно. У образца 1 в зависимостях  $\rho$  от T (рис. 3) для всех P, кроме значений вблизи нуля и  $P_{\rm max}$  можно выделить несколько (как правило три) активационных участка. Особенно отчетливо все участки проявляются при промежуточных значениях P (кривые 6–9). В области больших температур энергию активации, оче-



**Рис. 3.** Температурные зависимости  $\rho$  для разных значений упругой деформации. Образец 1. Величины деформаций указаны на вставках.



**Рис. 4.** Температурные зависимости  $R_{\rm H}$  для разных значений упругой деформации P, кбар: кривая I - 0, 2 - 0.6, 3 - 1.2, 4 - 2.2, 5 - 3.1. Образец 1. H = 300 Э. Сплошные линии  $- R_{\rm H}$ , штриховые  $- + R_{\rm H}$ .



**Рис. 5.** Температурные зависимости:  $a - \rho$  и  $b - R_{\rm H}$  для разных значений упругой деформации *P*, бар: кривые 1 - 0, 2 - 150, 3 - 230, 4 - 350, 5 - 480, 6 - 700, 7 - 900, 8 - 1150, 9 - 1500. Образец 4. Холл-эффект измерялся при H = 400 Э.

видно, следует соотнести с междузонными переходами. Следующий участок (по мере понижения температуры) нужно связать с переходом акцепторный уровень–зона проводимости. Интересно, что при этом в промежуточном (между указанными участками) диапазоне *T* может наблюдаться даже уменьшение удельного электрического сопротивления с понижением температуры. Как известно, такая зависимость проявляется у достаточно качественных кристаллов Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te *p*-типа полупроводниковой фазы (x = 0.20-0.30) и связана с ростом подвижности дырок при практически постоянной концентрации носителей. Это соответствует области температур, где доминирует уже примесная проводимость, однако "истощение" акцепторов оказывается еще не существенным. Наконец, в области наиболее низких температур ( $T = 1.7 - 10 \,\mathrm{K}$ ) отчетливо проявляется третий активационный участок — с наименьшими энергиями активации єз. Этот участок следует связать с прыжковой проводимостью по акцепторной зоне. При этом наблюдается явная зависимость  $\varepsilon_3$  от величины упругой деформации. При P = 0 проводимость в этой области температур практически не зависит от Т и, таким образом, носит металлический характер. С увеличением деформации  $\varepsilon_3$  сперва растет (кривые 5-8), достигает максимума  $\varepsilon_3 = (0.3 - 0.4)$  мэВ (кривая 9), а затем начинает уменьшаться и при P<sub>max</sub> (кривая 8) становится практически равной нулю. Это связано с уменьшением глубины залегания акцептора и увеличением перекрытия волновых функций соседних акцепторных состояний. Последнее можно объяснить только появлением в точке  $\mathbf{k} = \mathbf{0}$  экстремума валентной зоны  $\Gamma_6$  с малыми эффективными массами. Таким образом, в диапазоне упругих напряжений P = 0 - 3 кбар наблюдается двойной переход проводимости металл-диэлектрик-металл. Знакопеременные зависимости коэффициента Холла от температуры у образца 1 (рис. 4) также свидетельствуют об участии в проводимости нескольких типов носителей тока разного знака. Этот результат вполне согласуется с изложенной выше интерпретацией зависимостей  $\rho(P)$ от температуры.

Температурные зависимости  $\rho$  и  $R_{\rm H}$  для образцов с меньшими x (с большой исходной величиной "отрицательной запрещенной зоны") имеют значительно более простой вид (рис. 5, *a*, *b*). Из них следует, что в этом случае во всем диапазоне используемых упругих деформаций легкие дырки отстутствуют. Проводимость же, очевидно, определяется двумя механизмами. В области относительно небольших напряжений — вымораживанием электронов на акцепторные состояния, а при больших деформациях, когда вклад свободных электронов резко уменьшается, — другим механизмом. Последний, скорее всего, связан с прыжковым переносом по акцепторной зоне.

### 4. Заключение

В упругонапряженном состоянии структура валентной зоны бесщелевого полупроводника  $Cd_x Hg_{1-x}$  Те зависит от величины деформации и исходного положения зон легких и тяжелых дырок ( $\Gamma_6$  и  $\Gamma_8$  соответственно) в точке **k** = 0. Расстояние между ними (ширина "отрицательной запрещенной зоны") в исходном кристалле (P = 0) при постоянной температуре задается исключительно

составом х. При любых значениях х воздействие упругого напряжения приводит вначале (помимо образования энергетической щели) к возникновению боковых экстремумов у зоны тяжелых дырок Г<sub>8</sub>. В результате БП (или полуметалл) превращается в непрямозонный полупроводник с узкой энергетической щелью, ширина которой линейно растет с увеличением Р. Если состав х оказывается меньше значения 0.135-0.140 ("отрицательная запрещенная зона"  $|E_g| > 20-25$  мэВ), то при любых реально достижимых для Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te значениях деформации материал остается непрямозонным полупроводником. Если же исходное значение Eg по абсолютной величине меньше 20-25 мэВ, (0.140 < x < 0.160), то при максимально достижимых напряжениях ( $P \approx 3.5 \, \text{кбар}$ ) зона легких дырок  $\Gamma_6$  в точке  $\mathbf{k} = 0$  оказывается выше зоны Г<sub>8</sub>. В результате полупроводник становится прямозонным, и происходит двойной фазовый переход проводимости металл-диэлектрик-металл. При этом по мере роста Р тип проводимости БП при низких температурах меняется в следующей последовательности: электронная металлическая-электронная активационная-прыжковаядырочная металлическая проводимость.

## Список литературы

- Ф.Т. Васько, С.Г. Гасан-заде, В.А. Ромака, Г.А. Шепельский. Письма ЖЭТФ, 41, 100 (1988).
- [2] А.В. Германенко, Г.М. Миньков, Е.Л. Румянцева, О.Э. Рут. ЖЭТФ, 94, 242 (1988).
- [3] A.V. Germanenko, G.M. Minkov. Phys. Status Solidi B, **184**, 9 (1994).
- [4] Е.В. Баханова, Ф.Т. Васько. ФТТ, 32, 86 (1990).
- [5] Ф.Т. Васько, М.В. Стриха. УФЖ, **35** (5), 617 (1990).
- [6] С.Г. Гасан-заде, Г.А. Шепельский, Е.А. Сальков. ФТТ, 31, 35 (1997).
- [7] Е.Ф. Венгер, С.Г. Гасан-заде, М.В. Стриха, С.В. Старый, Г.А. Шепельский. ФТП, 34, 791 (2000).

Редактор Л.В. Беляков

## Band spectrum and double phase transition of a conductivity metal-dielectric-metal in elastically strained gapless $Gd_xHg_{1-x}Te$

E.F. Venger, S.G. Gasan-zade, M.V. Strikha, G.A. Shepelskii

V.E. Lashkariov Institute of Semiconductor Physics. National Academy Sciences of Ukraine, 01650 Kiev, Ukraine

**Abstract** The energy gap between the conductivity band bottom and the valence band top occurs in a gapless semiconductor  $Cd_xHg_{1-x}Te$  under uniaxial elastic deformation. The band structure of the new state depends on the initial position of the valence subbands, i.e. on the composition *x*. For *x* smaller than 0.135-0.140 the material becomes the semiconductor with an indirect gap. On the contrary, when 0.140 < x < 0.160, the  $\Gamma_6$ band in  $\mathbf{k} = 0$  point is situated higher that the  $\Gamma_8$  band under high deformations. In this case the semiconductor becomes a direct gap one, and the double phase transition of the conductivity metal-dielectric-metal occurs. The type of gapless semiconductor conductivity with a uniaxial strain increase at low temperatures changes as follows: electron metalic-electron activaton-hoppinghole metallic conductivity.